

Rugosímetros SV 2000/3000

Serie 178

Analizadores de rugosidad superficial



ESPECIFICACIONES

SurfTest SV-2000

Modelo No.	SV-2000N2	SV-2000S2	SV-2000M4
Fuerza de medición del detector	0.75mN	0.75mN	0.75mN
Recorrido vertical	— —	11.8pulg(300mm) Columna motorizada	11.8pulg(300mm) Columna Manual
Tamaño de la base de granito AxL	— —	24pulgx17.7pulg	24pulgx17.7mm
Recorrido	2pulg(50mm)		4pulg(100mm)
Linealidad del recorrido	1.2μpulg/2pulg (0.3μm/50mm)		0.3μm/100mm
Velocidad Medición	.004pulg/s, .008pulg/s .02pulg/s, .04pulg/s, .08pulg/s	.0008pulg/s, .002pulg/s, .004pulg/s, .008pulg/s, .02pulg/s, .04pulg/s, .08pulg/s	.002pulg/s, .004pulg/s, .008pulg/s, .02pulg/s, .04pulg/s, .08pulg/s
Posicionamiento	.02pulg/s, .08pulg/s Disponible alimentación manual	Se puede ajustar con joystick de .004pulg/s a .2pulg/s Ajustable por alimentación manual	0.5mm/s, 2mm/s, Disponible alimentación manual
Intervalo de medición	32000μpulg, 3200μpulg, 320μpulg		
Detector	Tipo: Estándar (178-396-2) Punta: Diamante, 60°/90° cónica (radio: 2μm/5μm) Método de detección: Inducción diferencial		
Datos de salida	Salida interface RS-232C		
Software de análisis de datos	SURFPAK-SV		
Fuerza	Vía adaptador CA(100-24V CA, 150VA)		
Dimensiones AxLxAlt†	263x82x144mm	710x50x905mm	710x50x711mm
Peso†	2.8kg	130kg	140kg

†Solamente unidad principal

La serie de Rugosímetros SV-2000/3000 incorporan una gran exactitud, un alto nivel de análisis y multifuncionalidad en el análisis en tres dimensiones y la medición del contorno fino, así como la medición convencional de la medición de la rugosidad superficial.

CARACTERISTICAS

- La serie rugosímetros SV-2000/3000 incorporan una gran exactitud, un alto nivel de análisis y multifuncionalidad en el análisis en tres dimensiones y la medición del contorno fino, así como la medición convencional de la medición de la rugosidad superficial.
- Periféricos como la mesa auto-nivelable y la mesa de ajuste de tres ejes se hayan disponibles para realizar la operabilidad y permitir la medición automática. Se instala el SURFPAK® un software dedicado al análisis de datos que permite una administración de datos en un formato consistente desde el área de trabajo al laboratorio.
- EITCON, el controlador de panel por contacto le otorga prioridad a la facilidad de uso y hace posible el análisis de alto nivel.
- La cerámica, bien conocida por sus prioridades anti-abrasivos se utiliza como guía de la unidad de avance del eje X, por los que no se requiere labricación.
- Escalas de vidrio de alta exactitud (resolución en el eje X: 0.05μm, en el eje Y: 1μm) interconstruidas para asegurar alta exactitud de posicionamiento.
- Equipado con una punta detector de alta exactitud.
- Equipado con varias funciones como la función de "compensación de rectitud" la cual mejora la exactitud lineal del eje X, la función de "compensación circular" para el movimiento vertical del detector y la función de "compensación de la punta del detector".
- El detector y los adaptadores se pueden reemplazar fácilmente ya que existe una amplia variedad de los mismos para aplicaciones específicas como la medición de hoyos pequeños o profundos.
- Una caja de control fácil de operar, se incluye en el SV-2000S2 y en el SV-3000S4/H4/W4/S8/H8/W8. La casa de control independiente de la unidad principal permite el posicionamiento, arrancar o detener la medición, la retractación y otras operaciones que se realicen remotamente. La posición de la unidad de avance hacia arriba/abajo y el recorrido del eje X, se pueden controlar fino manualmente.